

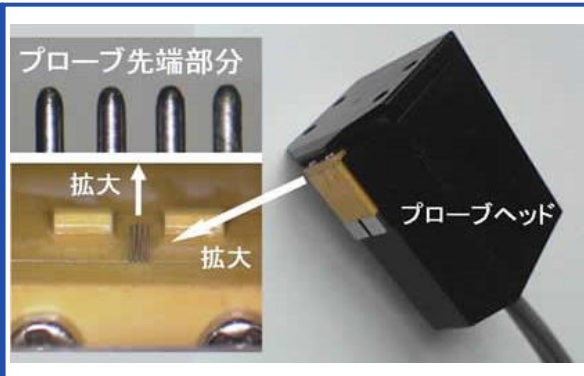
小さなサンプルの電気抵抗測定に最適！

accurate measurement of electrical resistance in a tiny area

0.1mmピッチ4探針プローブ

探針間隔0.1mmの4探針電気抵抗測定プローブです。空間分解能を、従来プローブに比べ1ケタ向上させ、サブミリ領域の電気抵抗測定を可能にしました。導電材料、半導体材料に関して、開発における簡易評価、生産におけるモニタとしてご利用いただけます。

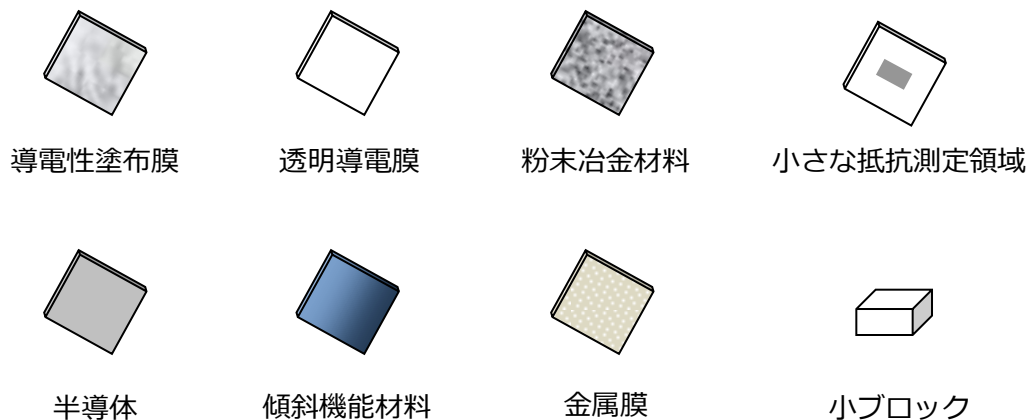
半導体、金属膜、透明導電膜、傾斜機能材料、粉末冶金材料など電極付け等のパターニングなしでプローブをサンプルにあてるだけで測定できます。通常の測定系(電流源、電圧計)がそのままご利用いただけます。



■【0.1mmピッチ4探針プローブ】仕様

測 定 方 式	直流4端子法
空 間 分 解 能	約0.5mm
標 準 探 針	S i 用WC探針 (測定対象素材に応じてご相談を承ります)
測 定 対 象	各種半導体膜、金属膜の他、導電性塗布膜、透明導電膜、粉末冶金材料、傾斜機能材料など各種導電性材料

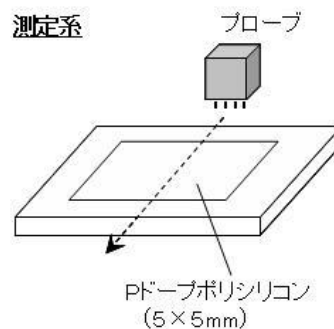
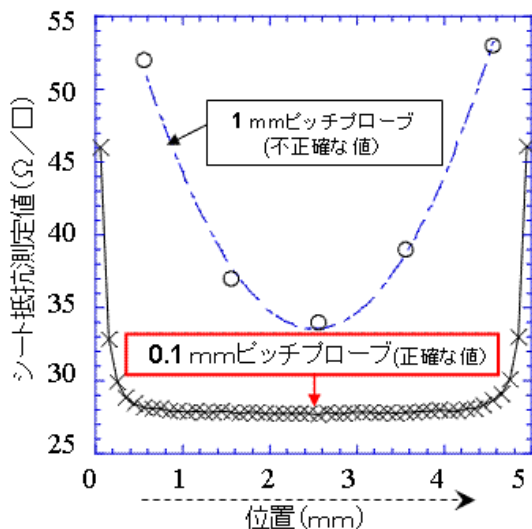
このような材料の電気抵抗測定に！



測定例 Pドーピングポリシリコンの抵抗測定

5mm角の一様な抵抗値のポリシリコン薄膜の測定例です。

従来のピッチプローブでは正確な値が測定できないのに対して、開発した0.1mmピッチプローブでは周辺0.5mm程度の領域を除いて、正確なシート測定が可能です。



本プローブは通常の測定系(電流源、電圧計)がそのままご利用いただけます。本プローブ専用の簡易測定治具や手動測定装置も用意しています。本プローブは平坦なシリコンや金属膜などの測定用ですが、特殊用途の測定プローブ作成に関してもご相談に応じます。



*文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

*本カタログ記載の内容は予告なく変更することがあります。